"偏频锁定"无调制的稳定激光器

施汉谦

(中国计量科学研究院)

提要:本文介绍了一种无调制激光输出的"偏频锁定"稳频方法。文中对"偏频 锁定"型激光器的工作原理、系统的主要部件及设计的考虑进行了较详细的描述。最 后还给出了一台已用于碘稳定 He-Ne 激光器的"偏频锁定"稳频的实际电路。

Bias frequency-locked unmodulated stable laser

Shi Hangian

(Chinese Academy of Metrology)

Abstract: A method of frequency stabilization — bias frequency locking, for output of unmodulated laser is introduced. A detailed description of operation principles, main components of the system and design considerations for bias frequency locked laser is given. Finally, a practical circuit for frequency stabilization of iodine stabilized He-Ne laser is described.

一、引 言

目前高稳定 He-Ne 激光器的稳频系统, 多数是采用小振幅调制激光谐振腔以获得误 差信号的极值控制系统。由于激光腔反射镜 的振动,往往造成激光输出具有较大的频率 调制。由于这种小振幅调制就限制了该类稳 频激光器的应用范围^[1]。近些年发展而被广 泛应用的无调制稳频激光器克服了以上缺 点。

二、主要部件及工作原理

"偏频锁定"型激光系统实际是一个自动 频率调整系统(以下简称 AFO)。 AFC 系统 主要由两个部件组成: (1) 鉴频器——其作用是指示出高稳定 激光器的频率和被稳定激光器频率间的偏 差,并产生与这个偏差相应的控制电压输出;

(2) 控制元件(压电陶瓷 PZT)——其 作用是直接改变被稳定激光器的频率并使它 趋近于高稳定激光器的频率。

因而 AFC 系统是一个方向性作用的系统,其作用方向如图1 所示。

通常在 AFC 系统中被稳定激光器工作 频率的额定值 f_B 和高稳定激光器的标准频 率 f_P 的数值不同,在我们的电路中 f_P 和 f_B 差一严格的固定值 f_0 ,故称"偏频"。在这种





收稿日期: 1979年8月9日。

• 14 •

电路中即使没有任何不稳定因素, f_B和 f_P 之间的差值始终是存在的,即:

 $f_B = f_P \pm f_0 \tag{1}$

在鉴锁器的输入端通常设置一个混频器 (或直接由光电接收器输入)用于鉴别出被稳 定激光器 f_B 与高稳定激光器 f_P 之间的差 频。

设被稳定激光参数在不稳定因素作用下 发生了变化,使 f_B 对其额定值而言变化了 Δf_i (在没有 AFC 情况下),这样就会使差频 也发生同样数值的变化,这时差频将等于 f_0 ± f_i , Δf_i 称起始失谐。此时鉴频器将受到 差频电压的作用在其输出端产生一个控制电 压,当 $\Delta f=0$,亦即 f_B 等于 $f_P\pm f_0$ 时,这个 电压应该等于零,而使 AFC 系统不工作;而 当频率偏离 f_0 时,在鉴频器输出端就应产生 一个大小取决于失谐 Δf 的电压。

控制元件 (PZT),它在鉴频器输出端电 压的作用下,就能使被稳定激光的频率发生 变化,其方向与起始失谐方向相反,因此, f_B 的值就趋于额定值 $f_P \pm f_0$,也即只要 AFC 系 统一工作,就必然存在 $|f_B - f_P| < \Delta f_i$ 关系 式,即当失谐的符号发生变化,鉴频器输出电 压相应改变其极性时,PZT 对被稳定激光器 频率的作用就永远应该使起始失谐 Δf_i 减

小。

三、稳频系统及各部分参数 的选择方法

"偏频锁定"系统电路如图2所示。

 2. 鉴频器的选择:考虑到鉴频器的几个质量指标,本控制系统选用了国产组件 5G32 作符合门正交鉴频。这种鉴频器实际 是一种相移型检波电路,它由限幅中放、LC 移相网络和双差分模拟乘法器作鉴相器而 组成。工作原理如图 3 所示。

2. 鉴频器带宽的确定: 在通常的调频 接收设备中,为保证调频接收的不失真,鉴 频器的带宽应超过下列计算值: $B=2[\Delta f_{max}$ + $(f_m)_{max}]$,其中 Δf_{max} 是最大频偏, $(f_m)_{max}$ 是最高调制频率。

在我们使用的碘吸收 He-Ne 激光器中, 由于调制信号幅值较大,所以虽然激光频偏 峰峰值往往达7兆赫以上,但由于"偏频锁 定"系统是一个闭环控制的频率负反馈系统, 所以差频中频信号的频偏可以被压缩到调频 信号频偏的 $\frac{1}{1+S_DS_PG}$,因而事实上鉴频器 带宽不需要做得那么宽,在我们系统中鉴频 器设计成中心频率 f_0 为 12兆赫,带宽 $B_D \approx$ 2兆赫。



图 2 "偏频锁定"系统电路图



图 3 5G32 鉴频器的工作原理

3. 前置放大器的考虑:由于 5G32 电路 V_{±λ} 与输出 V_F 具有如图 4 所示的函数关系,在低注入时最佳注入值为 60 毫伏,当 V_{±λ} >700 毫伏时为高注入状态。不同注入状态下的鉴频特性如图 5 所示。在低注入状态时鉴频特性呈 8 形特征,此时灵敏度较低,线性范围较窄;在高注入状态下工作时,由于模拟乘法器内晶体管工作在导通截止状态有限







16

幅作用,所以调频波移相后的幅度变化可以 不考虑;又因大信号时乘法器的鉴相特性在 ²7 32 附近有直线关系,所以此时灵敏度较高, 线性范围较宽。基于拍频信号有效值在5毫 伏左右,考虑到信号注入值的变化,我们设计 的前置放大器电压增益在80倍左右,具有约 20 毫伏的输入动态范围,因而尽量使鉴频器 工作在接近高注入状态。

4. 积分放大和直流高压放大器的考虑

(1) 积分放大器

(a)由于 5G32 鉴频器输出端有一个固定的直流偏置,所以积分器正、反向输入端接成减法器,我们采取在同向端接一由 5G14 组件构成的可调恒压源;

(b)积分器采用增益可调的近似比例积 分电路,比例电阻可使积分放大器在一定放 大倍数下增加环路响应时间。

(c) 积分器输出端的 *RC* 滤波电路可起 到再次滤除残余高频及起积分器输出端的短 路保护作用。

(2) 高压直流放大器

(a) 因为PZT的等效电容 $C = \frac{sl}{2\ln\frac{R_2}{R_1}}$

其中 $R_1 = 12$ 毫米、 $R_2 = 13$ 毫米分别为 PZT 的内外径, l 为 PZT 的长, 若为 20~30 毫米 时可得 $C \approx 1$ 微法左右。如其时间常数为1 秒,则直流放大器的输出阻抗要约1兆欧。 ε 为介电常数。

(b) 电压控制范围纯决定系统的扰动 量,对温度而言, $\Delta T = \pm 3^{\circ}$ C 时如腔长 d = 33厘米, PZT 的压电系数 $k_c = 0.3 微 \times /100$ 伏, 则输出电压为 $\pm u_{out} = \pm \frac{dl}{dT} \frac{1}{k_c} \Delta T = \pm 330$ 伏。

(c)考虑到手调扫描压电陶瓷电压的方 便,我们采用了高输出阻抗的差动直流放大 器方案,并分粗、细二档调零,细调有±75 伏 的调节量作扫描电压用,这样采用+450 伏 供电高压较宜。

5. 吸收回路的考虑

若能确切地知道鉴频器和 PZT 的静特 性曲线,我们就能根据这两个静特性曲线作 出对应于每一个起始失谐 Δf_i 的数值而确 定的相应的剩余失谐的数值 Δf_o ,由 Δf_o = $\varphi(\Delta f_i)$ 的一一对应关系来作出该系统的动 特性曲线。由于我们的鉴频器还不是工作在 真正的高注入状态,所以实验发现在鉴频器 的中心频率两侧还存在稳定平衡点,为此必 须加吸收回路予以排除。我们采用了桥 T式吸收电路,消除了低频端的鉴频器过零 点。

6. 锁定指示及控制电路

在实验室通常借助频谱仪作锁定指示用,但考虑到现场使用的方便,所以在本系统中增设了专门的锁定指示及控制电路,其线路如图 6 所示。



图 6 锁定指示及控制电路图

其原理为:由前置放大器来的偏频信号 经一级共射-共基选频放大,然后由C₁、C₂ 和 D₁、D₂完成倍压检波,在负载 R 上得到上 负下正的直流电压,其大小和有无直接反映 了被锁定信号的大小与有无,这直流信号就 是下级施密特触发电路的控制信号,W 可以 调整触发电路的固定直流负偏压,从而调节 施密特电路的反转电位。正常工作时使 BT₃ 处于截止状态, BT₄ 处于导通状态,也即"绿" 灯为锁定,"红"灯为失锁。

四、环路性能分析及测试

当系统无相位失真时, AFC 系统的稳定

性取决于调整系数 K 的符号。本系统在鉴频器后存在 BC 滤波器及近似比例积分等惯性环节,因而分析设计系统时宜从系统微分方程着眼。

设系统在自由振荡下的频偏为 4f,鉴频器到控制元件间滤波器的传递函数为 D(P),则根据下列控制电压的瞬时值 Vo 所 满足的两个关系式:

$$\begin{cases} V_c = \Delta f \cdot S_D \cdot D(P) \\ \Delta f = V_c \cdot S_{PZT} \end{cases}$$
(2)

得到 AFC 系统自由振荡的微分方程:

$$1 - D(P) \cdot S_D \cdot S_{PZT} = 0 \tag{3}$$

为此我们可将偏频锁定环路方框图简化 成如图 7 所示。



图 7 偏频锁定环路方框图

其中S=S_D•S_{PZT}称环路增益常数。由图7可见

$$(f_P-f_B)\cdot S\cdot D(P)\cdot \frac{1}{1+P\tau_{PZT}}=f_B$$
 (4)

所以闭环传递函数

$$W(P) = \frac{f_B(P)}{f_P(P)}$$
$$= \frac{S \cdot D(P)}{1 + SD(P) + P\tau_{PZT}} \qquad (5)$$

本系统中除积分器和压电陶瓷的时间常数较大外,其它几个 RC 滤波环节均是小惯性环节,可予以忽略。

如图 8 所示,近似比例积分环节的传递 函数为

$$F(P) = \frac{K_T(\tau P + 1)}{\tau P} \tag{6}$$

其中, $K_T = \frac{R_2}{R_1}$ 为比例系数; $\tau = R_2 O$ 为积分时间常数; F(P)实际就是中间滤波器的传递函数 D(P), 将(6)代入(5)式得



所以可将此系统看作一个二阶系统。满足二 阶最佳调整时,(7)式分母中一次项系数应等 于 $\sqrt{2}$ 倍二次项系数的开方:

$$\frac{(1+SK_T)\tau}{SK_T} = \sqrt{2}\sqrt{\frac{\tau\cdot\tau_{\rm PZT}}{SK_T}} \quad (8)$$

考虑到 $SK_T \gg 1$, (8) 式左端略去 $\frac{1}{SK_T}$ 一项后可得

$$\tau = 2\tau_{\rm PZT} / SK_T, \quad K_T = \frac{2\tau_{\rm PZT}}{S\tau} \qquad (9)$$

这样,W(P)的分母项写成标准形式(忽略一次项中的 $\frac{1}{SK_{T}}$): $T_{t}^{2}P^{2}+\sqrt{2}T_{t}+1$ 得

$$T_t = \sqrt{2} \frac{\tau_{\text{PZT}}}{SK_T} \tag{10}$$

系统过渡过程的快慢取决于(10)式 T_t 的大小, T_t 称等效时间常数。在此还需注意 一个问题,即在(7)式分子中出现了 $\tau P+1$ 项,这是一个比例微分项,其存在将引起突加 给定时出现超调,我们是通过另加滤波环节,

其中,人,一⁴⁴,为比例活泼;下一起0万积分 时间常差, F(F)实际就是中间递减器的代述 需要 15.4% (%)代入(%)式得 即加 $\frac{1}{T_L P+1}$ 的惯性环节,当调整到 $T_L = \tau$ 时,就可对消分子项,从而避免了超调。

以上是选择系统稳定性参数时的定量关 系,可供设计系统时参考。在实际过程中,诸 如 K_{T} 、 τ 等参数采用实验方法确定还是较方 便的。我们是通过先将积分电容短路,在闭 环状态下,逐渐增大反馈电阻 R_2 观察在阶跃 给定时输出量的变化,以不出现超调(即超出 允许的振荡)为限,由于确定好 R_2 ;然后再接 近 C,令C由大逐渐减小,观察在阶跃给定 条件下达到使过渡过程既无明显延迟又不 产生振荡为止。本系统的 R_2 约 <20 千欧 为宜,C约为2 微法左右。

我们对系统的调整系数 K 进行了理论 计算及实测,基本是很好吻合的。K 值约在 2×10⁴ 左右。

本系统的参数如下: $S_D = 1 \sim 1.4$ 毫伏/ 千赫, $S_{PZT} = 4.5 \sim 7.5$ 千赫/毫伏;积分放大 器的电压增益约 50 倍,高压直放的电压增益 约 65 倍。

系统跟踪精度(经多次测量)用1秒的阿 仑方差计算得 σ_θ≈2×10⁻¹²;

偏频锁定碘稳定氦-氖激光器的精度,用 1秒阿仑方差计算得 σ≈5×10⁻¹¹。

参考文献

- V. Vari, R. C. Bostrom; Rev. Sci. Inst.; 1968, 39, 1304.
- [2] Jon Berger, R. H. Lovberg; Rev. Sci. Inst.; 1969.
 40, 1569.
- [3] V. Gerard; J. Sci. Inst., Ser2, 1969, 2, 933.
- [4] D. C. Wilson, W. R. C. Rowley; J. Sei Instt., 1966, 43, 314.
- [5] K.Tanaka, T. Sakural; "1967 Sixth International Quantum Electronics Conference", Digest of Technical Papers, p48.

环路性能分析及测试

這個位生產輸出為對了基礎的程序